



تشخیص پرتودیدگی سیب زمینی به وسیله اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی

منیره شریف زاده^{*}, مصطفی سهرابپور

مرکز تابش گاما، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: ۸۴۸۶ - ۱۱۳۶۵، تهران - ایران

چکیده: در این کاربیووهشی، هویت سیب زمینی پرتودیده (نوع آلفا)، به وسیله امپدانس الکتریکی آن تعیین و بررسی شده است. اعمال جریان متغیر حدود ۳ میلی آمپر هرمه با تغییردادن بسامد آن توسط الکترودهای فلزی که درون برشی از سیب زمینی فروبرده می‌شود، سبب تغییر امپدانس آن شده و در بسامدهای خاصی تشخیص امکان‌پذیر می‌گردد. پارامترهای موردنظر عبارتند از: نسبت امپدانس‌ها از صفر تا ۱۸۰ ثانیه (Z₀/Z₁₈₀) پس از قراردادن الکترود در نمونه، همچنین نسبت آنها در بسامدهای بالا (50 kHz) به بسامدهای پایین (0.05, 0.1, 5 kHz). نتایج آزمایشها نشان می‌دهند که افزایش مقدار دُر باعث افزایش امپدانس می‌شود، در صورتی که افزایش بسامد جریان موجب کاهش آن می‌گردد، به طوری که عملاً تشخیص نمونه‌های پرتودیده در بسامدهای بالاتر از 50 kHz ممکن نخواهد بود. همچنین نسبت Z_{50k}/Z_{5k} به سبب بستگی داشتن به دُر جذب شده و تغییرات اندک آن در مدت نگهداری نمونه‌ها بهترین پارامتر برای تعیین نمونه‌های پرتودیده، حتی حدود ۶ ماه پس از پرتودیده است و می‌توان با آن مقدار دُر را نیز برآورد کرد. از نتایج تجربی بدست آمده در بسامدهای ذکر شده نیز روابط ریاضی مناسبی که نمایانگر ارتباط امپدانس با دُر جذب شده و دمای اندازه‌گیری باشد در قالب سه فرمول استنتاج شد. با این فرمولها می‌توان مقدار دُر را در محدوده دمای اندازه‌گیری شده (20 - 35°C) با خطای حد اکثر ۸ درصد برآورد کرد.

واژه‌های کلیدی: بسامد، امپدانس، پارامتر تشخیص پرتودیدگی، سیب زمینی پرتودیده

Identification of Irradiated Potatoes by Impedance Measurements

M. Sharifzadeh*, M. Sohrabpour

Gamma Irradiation Center, AEOI, P.O.Box: 11365 - 8486, Tehran - Iran

Abstract: Identification of irradiated potatoes (Alpha variety) by the electrical impedance measurements has been carried out. Experiments were performed by passing ~3mA alternating current through the potato tubers that were punctured with the galvanized metallic electrodes. The parameters Z₀/Z₁₈₀ (impedance ratio at 50Hz, zero to 180 seconds post puncturing), Z_{50k}/Z_{5k}, Z_{50k}/Z_{0.5k}, Z_{50k}/Z_{0.05k} (impedance ratio at 50kHz to 5kHz, 0.5kHz and 0.05kHz, respectively) were determined at various temperatures and the best temperature for the measurement was obtained. The selection of the identification parameter was based on its constancy over the post irradiation storage time (six months), as well as, its dependency on the magnitude of the absorbed dose. Based on the above criteria, the impedance ratio of Z_{50k}/Z_{5k} was determined to be the best identification parameter. The obtained empirical formulas allow to estimate the applied dose and also to differentiation between the irradiated and unirradiated potatoes at the temperature of the (20-35°C).

Keywords: frequency, impedance, identification parameter, irradiated potato

*email: msharifzadeh@aeoi.org.ir

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴/۴/۱۳۸۲ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۲/۹/۱

۱- مقدمه

اندازه‌گیری، مدت نگهداری، حرارت و غیره بر امپدانس و انتخاب بهترین شرایط برای تشخیص پرتودیدگی انجام شده است.

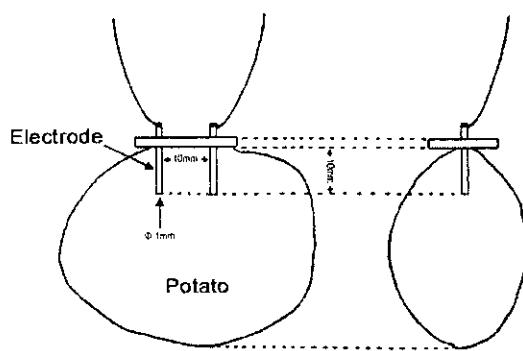
۲- روش کار

در این کار تحقیقی، نمونه‌های سبزه‌ی زمینی (نوع آلفا) بکار رفته و پرتودهی آنها به وسیله گاماسل ۲۲۰ با نرخ دُز $1000 \pm 0.44 \text{ kGy/h}$ صورت گرفته و دُزهای $0, 50, 100, 200, 500, 1000$ گری اعمال شده است. نمونه‌های پرتودهی شده، پس از پرتودهی به همراه نمونه‌های پرتوندیده در انکوباتور 15°C نگهداری شدند.

اندازه‌گیری امپدانس در دمای 25°C به وسیله الکترودهای سوزنی شکل از جنس فلز زنگ نزن، به قطر 0.9 میلی متر و با طول 10 میلی متر و به فاصله 10 میلی متر از یکدیگر انجام گرفته است (شکل ۱). این الکترودها را به نوساننما (اسیلوسکوپ) متصل کرده و پس از فروکردن آنها در سبزه‌ی زمینی و برقراری جریان متناوب حدود 3 میلی آمپر بین آنها، با اندازه‌گیری ولتاژهای موردنظر، امپدانس محاسبه می‌شد. ولتاژها بلافاصله پس از فروکردن الکترودها در نمونه و حداقل تا 3 دقیقه پس از آن، در بسامدهای مختلف اندازه‌گیری شدند [۲ و ۳].

۳- یافته‌ها و نتیجه‌گیری**۳-۱- امپدانس در بسامدهای مختلف**

امپدانس سبزه‌ی زمینی‌هایی که پس از پرتودهی با دُزهای $0, 50, 100, 200, 500, 1000$ گری به مدت یک هفته در دمای 15°C نگهداری شده بودند با بسامدهای مختلف در دمای 25°C



شکل ۱- طرح ساده وضع الکترودهای فلزی مورد استفاده در اندازه‌گیری امپدانس سبزه‌ی زمینی

فرایند پرتودهی مواد غذایی در بعضی از کشورهای جهان در شرایط استاندارد مجاز اعلام شده، در حالیکه در کشورهای دیگر به علت مخالفت مصرف کنندگان و یا نهادهای کنترل کننده، پذیرفته نشده است. پرتودهی معمولاً باعث تغییرات ظاهری در مواد غذایی نمی‌شود و تشخیص یک ماده غذایی پرتودیده از پرتوندیده به سختی امکان‌پذیر است. از این رو در بیشتر کشورهای جهان توجه زیادی به تحقیق درباره روش‌های فیزیکی، شیمیایی و زیست‌شناسی برای تشخیص پرتودیدگی مواد غذایی وجود داشته و تعیین هویت مواد غذایی پرتودیده توسط دستگاه‌های کنترل کننده با استفاده از روش‌های متداول از اهمیت خاصی برخوردار است.

یکی از کاربردهای پرتودهی مواد غذایی جلوگیری از جوانه‌زدن پیازها و غدد (سبزه‌ی زمینی) با استفاده از دُزهای کم پرتوهای یونیزه کننده است. تحقیقات Delincee (۱۹۹۱) درباره ویژگیهای بافت سبزه‌ی زمینی پرتودیده نشان داده است که مقدار دُز جذب شده کمتر از 150 Gy هم ممکن است تغییراتی در امپدانس الکتریکی آن ایجاد کند که مبنای تشخیص پرتودیدگی سبزه‌ی زمینی می‌شود. امپدانس یک گیاه بستگی به شرایط فیزیولوژیکی آن دارد و می‌توان آنرا برای بررسی آلودگیهای ویروسی، وضعیت زمستان گذرانی جوانه‌ها و همچنین تشخیص بافت‌های پرتودیده از پرتوندیده بکار برد [۱].

روشی که بتوان با آن سبزه‌ی زمینی‌های پرتودیده را تشخیص داد باید به دُز پرتودهی بستگی داشته و مستقل از عوامل دیگر، از جمله نگهداری، رشد، تولید و نوع سبزه‌ی زمینی باشد. روش‌های بکار رفته، اغلب مربوط به فعالیت آنزیم‌ها، یا مقدار عناصر موجود در سبزه‌ی زمینی، مانند کربوهیدراتها، اسیدهای آمینه و ویتامینها می‌باشند که مقادیر آنها در اثر این عوامل تغییر می‌کند [۱ و ۲].

استفاده از امپدانس و هدایت الکتریکی یکی از روش‌های عملی و قابل اعتماد برای تشخیص پرتودیدگی مواد غذایی غده‌ای، از جمله سبزه‌ی زمینی است. بنابراین، برای تعیین هویت سبزه‌ی زمینی پرتودیده (نوع آلفا)، استفاده از اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایشها به منظور بررسی اثرهای بسامد جریان متناوب، مقدار دُز جذب شده، زمان

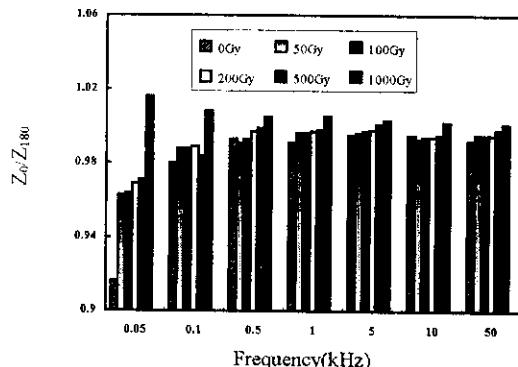
سوراخ کردن نمونه تا ۱۸۰ ثانیه پس از آن) یعنی Z_0/Z_{180} به علت تغییر امپدانس، معمولاً برای تشخیص پرتو دیدگی مناسب می‌باشد. [۲]

این نسبت برای نمونه‌های پرتو دیده در ذرهای و بسامدهای مختلف، که به مدت یک هفته در دمای 15°C نگهداری شده بودند در دمای محیط (25°C) اندازه گیری شد. مقدار بدست آمده، متوسط ۶ اندازه گیری در ۶ نمونه است. پارامتر Z_0/Z_{180} با افزایش ذره تا بسامد 10 kHz افزایش نشان می‌دهد، پس از آن تغییراتش ناچیز می‌شود (شکل ۴).

برای انتخاب بهترین بسامد در تعیین Z_0/Z_{180} نسبت واریانس $F = Vt/Ve$ حساب شد [۲]، و بسامد ۵۰ هرتز به سبب دارا بودن بیشترین مقدار F (جدول ۱)، برای تشخیص پرتو دیدگی بکار رفت.

۳-۳- اندازه گیری دما

نمونه‌های مورد نظر با ذرهای 1000 Gy پرتو دهدی و به مدت یک هفته در دمای 15°C نگهداری شدند. امپدانس



شکل ۴- تغییرات پارامتر Z_0/Z_{180} با بسامد جریان متناسب در 25°C

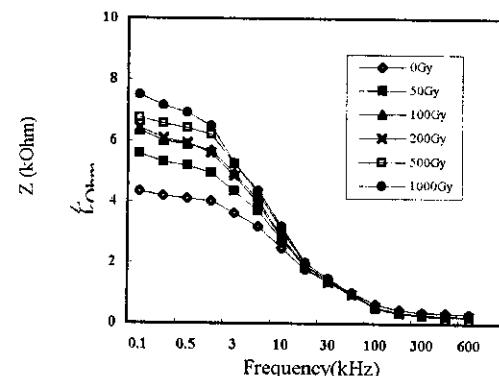
جدول ۱- نسبت واریانس ($F = Vt/Ve$) پارامتر تشخیص پرتو دیدگی در بسامدهای مختلف جریان متناسب

Basis	50k	10k	5k	1k	500	100	50	Frequency (Hz)
1.22	1.93	2.45	2.44	2.46	5.65	11.46	F	
60	60	60	60	60	60	60	n	

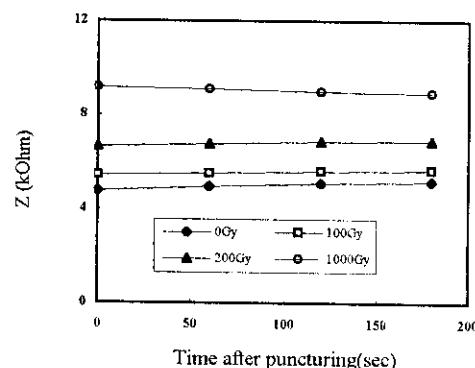
اندازه گیری شد. شکل ۲ نتایج این اندازه گیری را نشان می‌دهد. هر نقطه در این شکل معرف میانگین ۱۰ اندازه گیری در ۵ نمونه است که پس از فروبردن الکترود در سیب زمینی بی‌درنگ اندازه گیری شده است [۱ و ۵]. این شکل نشان می‌دهد که در بسامدهای پایین مقدار امپدانس بسته به مقدار ذره متفاوت است ولی در بسامدهای بالا این تفاوت مشاهده نمی‌شود. به همین جهت، نسبت مقدار امپدانس در بسامد بالا به مقدار آن در بسامد پایین (مانند $Z_{0.5k}/Z_{0.1k}$ و $Z_{0.5k}/Z_{0.05k}$) برای تعیین اثر پرتو دیدگی مناسب است [۱ و ۲].

۳-۲- تغییر امپدانس نمونه‌های سیب زمینی پس از سوراخ کردن آنها با الکترود

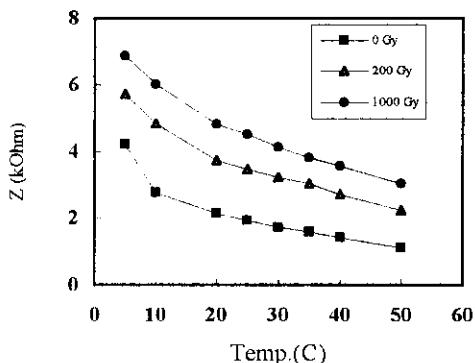
امپدانس نمونه‌های سیب زمینی پرتو دیده پس از سوراخ کردن، حداقل تا ۱۸۰ ثانیه افزایش می‌یابد، اما امپدانس نمونه‌های 200 Gy پرتو دیده تقریباً ثابت باقی می‌ماند و امپدانس نمونه‌هایی که 1000 Gy پرتو دیده‌اند کاهش می‌یابد (شکل ۳). این نتایج نشان می‌دهند که نسبت تغییر امپدانس نمونه‌ها (از لحظه



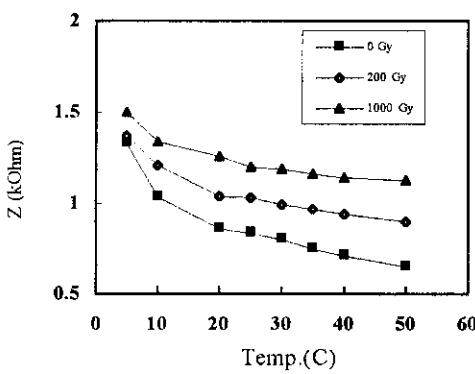
شکل ۲- تغییرات امپدانس بر حسب بسامدهای مختلف جریان متناسب



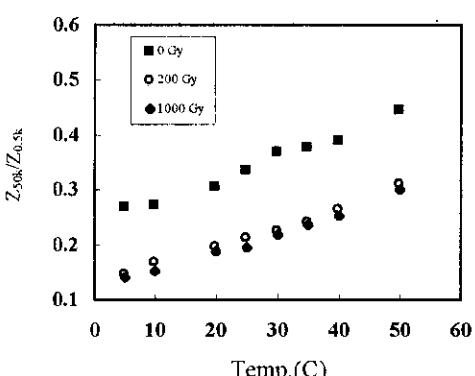
شکل ۳- نمودارهای تغییرات امپدانس با زمان در بسامد 50 Hz و در پرتو دیدگی های مختلف پس از سوراخ کردن سیب زمینی با الکترود



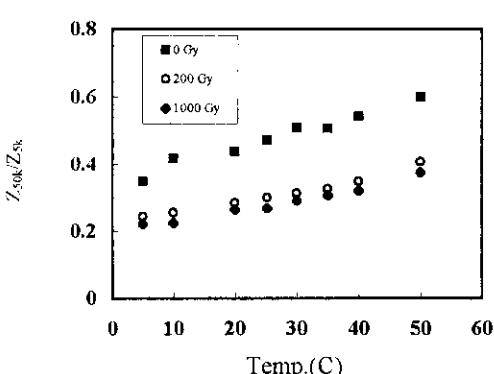
شکل ۶- تغیرات امپدانس با دمای اندازه گیری در بسامد ۵ kHz



شکل ۷- تغیرات امپدانس با دمای اندازه گیری در بسامد ۵ kHz



شکل ۸- تغییرات پارامتر تشخیص پرتو دیدگی با دمای اندازه گیری



شکل ۹- تغییرات پارامتر تشخیص پرتو دیدگی با دمای اندازه گیری

آنها با استفاده از دستگاه کنترل دما، در دماهای مختلف (از ۵ تا ۵۰°C) و در بسامدهای مختلف اندازه گیری و پارامترهای Z/Z_{18} و $Z_{0.5k}/Z_{0k}$ و $Z_{0.5k}/Z_{18.5k}$ در هر دما حساب شدند [۱]. مقادیر نشان داده شده در شکلها ۵ تا ۱۰ متوسط ۱۰ آندازه گیری در ۵ نمونه است. در دماهای ۲۰°C تا ۳۵°C امکان تشخیص پرتو دیدگی و برآورد مقدار دُز جذب شده بیشتر است، ولی در دماهای بالاتر از این حد، امکان تعیین هویت کم می شود [۲].

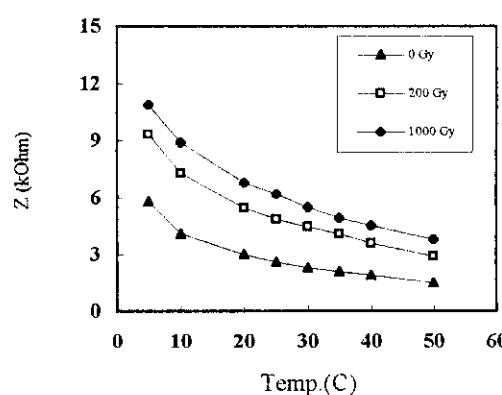
برای تعیین بهترین شرایط تشخیص نمونه های پرتو دیده نسبت واریانس F برای امپدانس ها و پارامترهای مختلف حساب شد (جدول ۲). تقریباً همه پارامترها در محدوده دمای ۲۵°C دارای F فاکتور F بیشتری نسبت به دماهای دیگر بوده و بیشترین مقدار F مربوط به پارامتر $Z_{0.5k}/Z_{18.5k}$ می باشد. با استفاده از نتایج بدست آمده، دمای ۲۵°C بهترین دما برای تشخیص پرتو دیدگی سیب زمینی شناخته می شود.

با توجه به شکلها ۵ تا ۷ و از نتایج تجربی بدست آمده در بسامدهای مورد استفاده، روابط ریاضی نمایانگر ارتباط مناسب امپدانس با دُز جذب شده و دمای اندازه گیری در قالب سه فرمول استنتاج شد. با این فرمولها می توان مقدار دُز پرتو دهنی را در محدوده دمای اندازه گیری (۲۰ - ۳۵°C) با حد اکثر خطای ± 8 درصد برآورد کرد:

$$1) Z_{50k} = [0.29 + (0.00012D^{.64})][6.2 - \ln(t)]$$

$$2) Z_{5k} = [1.2 + (0.12D^{.25})][4.9 - \ln(t)]$$

$$3) Z_{0.5k} = [1.82 + 0.63D^{.17}][4.7 - \ln(t)]$$



شکل ۵- تغیرات امپدانس با دمای اندازه گیری در بسامد ۵ kHz

جدول ۲- نسبت واریانس ($F=Vt/Ve$) پارامترهای تشخیص پرتودیدگی بدست آمده در ماهات مختلف برای سیب زمینی های پرتودیده در ذرهای ۰، ۲۰۰، ۱۰۰۰ گرمی

دما (°C)								پارامترها
50	40	35	30	25	20	10	5	
30.1	29.7	30.9	31.7	31.9	25.77	30.71	27.5	$Z_{0.5k}$
30.7	20	23.1	24	34.7	17.6	18	6.8	$Z_{50k}/Z_{0.5k}$
29.5	31.3	29.8	31.8	31.74	22.8	30.76	15.62	Z_{5k}
31.2	22.75	29.1	20.7	24.07	16.12	15.36	6.25	Z_{50k}/Z_{5k}
28.52	27	29.24	30.72	32.75	28.15	29.47	21.6	$Z_{0.5k}$
7.06	7.8	10.7	15.5	17.7	11.04	11.77	5.2	$Z_{50k}/Z_{0.5k}$
19.5	13	13.2	14.3	12.75	14.8	7.87	2.1	Z_{50k}

پارامتر برای تشخیص پرتودیدگی شناخته شده است.

۳-۴- تشخیص در مدت نگهداری

سیب زمینی های پرتودیده در دمای ۱۵°C به مدت ۶ ماه نگهداری شده اند و در این مدت امپانس آنها در دمای ۲۵°C اندازه گیری شده است. نتایج پنج اندازه گیری در پنج نمونه در شکلهای ۱۰ تا ۱۳ نشان داده شده است [۱ و ۶]. اندازه گیری امپانس سیب زمینی های پرتووندیده تا ۳ ماه بیشتر تعقیب نشد، زیرا پس از گذشت یک ماه و نیم، جوانه ها شروع به رشد کرد و طول آنها پس از گذشت این مدت به چند سانتی متر رسیده بود. با توجه به نتایج بدست آمده پس از ۶ ماه اندازه گیری امپانس، مقادیر انحراف معیاری و آنالیز واریانس F برای پارامترهای مورد نظر حساب شده اند (جدول ۳). بر طبق این جدول، پارامتر $Z_{0.5k}/Z_{0k}$ ، همچنین امپانس Z_{0k} دارای بیشترین مقدار F بوده و در تمام مدت نگهداری تقریباً ثابت بوده اند، ولی پارامترهای $Z_{0.5k}/Z_{180}$ به تدریج پس از پرتودهی تغییر کرده و مقادیر آنها پراکنده گی بیشتری نسبت به مقادیر پارامترهای دیگر داشته اند. به همین جهت نسبت $Z_{0k}/Z_{0.5k}$ در دمای ۲۵°C بهترین

بر اساس نتایج بدست آمده، نسبت $Z_{0.5k}/Z_{0k}$ پارامتر مناسبی برای تشخیص پرتودیدگی سیب زمینی (نوع آلفا) تا حدود شش ماه پس از پرتودهی است. همچنین به کمک روابط تجربی بدست آمده برای امپانس در بسامدهای مختلف، به ویژه برای Z_{0k} با توزیع یکنواخت تر در محدوده پرتودهی (تا ۲۰۰ گرمی) مقدار ذرهای رانیز می توان در مدت نگهداری به طور تقریبی بدست آورد.

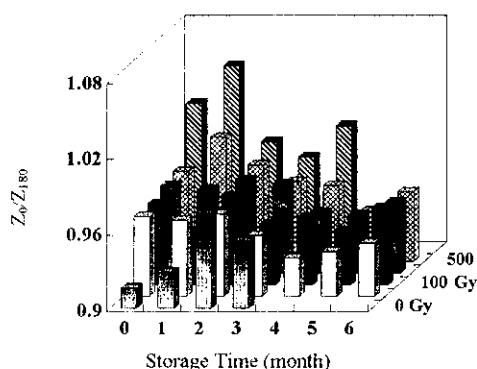
گرچه اندازه گیری امپانس، روش عملی و قابل اعتمادی است که می توان به وسیله آن نمونه های پرتودیده را از پرتووندیده تشخیص داد، ولی برای کاربرد این روش، مطالعات بیشتری بر روی واریته های دیگر سیب زمینی، و شرایط دیگر از جمله دماهای مختلف نگهداری و نواحی گوناگون برداشت محصول لازم است.

جدول ۳- ارتباط بین امپانس و پارامترهای تشخیص پرتودیدگی و ذرهای پرتودهی

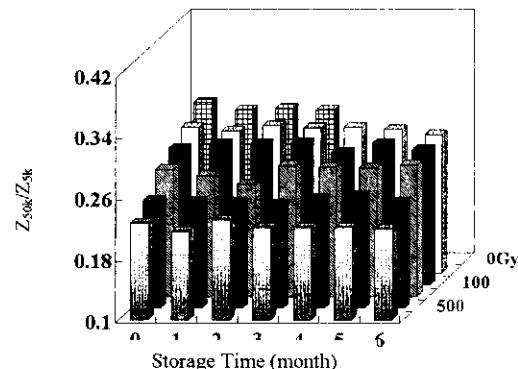
Parameter						(Gy)
$Z_{0.5k}$	Z_{5k}	$Z_{50k}/Z_{0.5k}$	Z_{50k}/Z_{5k}	$Z_{50k}/Z_{0.05k}$	Z_{0}/Z_{180}	
4.27±.440	3.01 ± .365	0.195±.024	0.302±.025	0.219±.025	0.940±.039	0
4.70±.586	3.28 ± .413	0.177±.025	0.285±.016	0.20 ± .024	0.948±.025	50
4.74±.685	3.42 ± .463	0.182±.024	0.280 ± .019	0.203±.023	0.954±.030	100
5.23±.780	3.64±.486	0.166±.028	0.264 ± .024	0.184±.029	0.959±.020	200
6.60±1.35	4.25±.636	0.144±.030	0.240 ± .020	0.158±.031	0.963±.031	500
7.67±2.47	4.57±.734	0.122±.034	0.221±.022	0.141±.036	1.003±.042	1000
31.42	34.7	27.14	60.4	17.06	14.82	F-Value (تعداد نمونه ها) n
195	195	195	195	195	195	



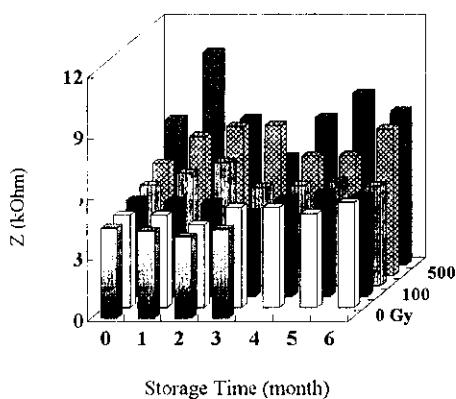
پارامترهای مختلف سبزه زمینی های نگهداری شده در ۱۵°C



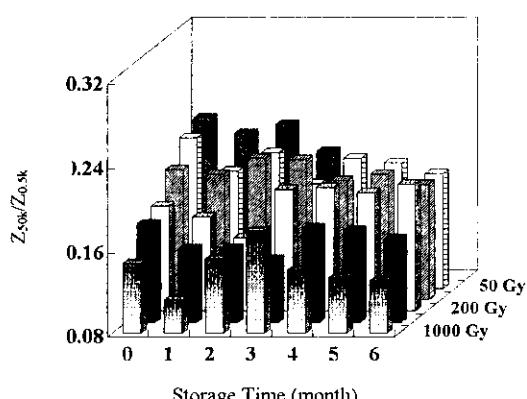
شکل ۱۲



شکل ۱۰



شکل ۱۳- امپدانس در ۵kHz



شکل ۱۱

خسرو محمودنژاد که در انجام این پژوهه مرا باری نمودند تشکر
و قدردانی می نمایم.

بدینوسیله از خدمات آقایان عباسعلی مرشد، علی سرلک و

تشکر و قدردانی

References:

1. T. Hayashi, "Identification of irradiated potatoes by impedemetric methods," In: Health Impact Identification and Dosimetry of Irradiated Foods, Report of WHO Working Group, ericht des Institutes für Strahlenhygiene des Bundesgesundheitsamtes, ISH - 125, 432-452. Nneuherberg, FRG (1988).
2. T. Hayashi, M. Iwamoto, K. Kawashima, "Identification of irradiated potatoes by impedance measurements," Agric. Biol. Chem. (Tokyo) **46**, 905-912 (1982).
3. T. Hayashi, K. Kawashima, M. Iwamoto "Impedance measurement of irradiated potatoes," Nippon Shokuhin Kogyo Gakkai-shi. Journal of Food Science and Technology, Japan **30**, 1, 51-54 (1983).
4. IAEA-TECDOC-587, "Analytical Detection Methods for Irradiated Foods," IAEA, Vienna 8 (1991).
5. T. Hayashi, S. Todoriki, K. Otobe, J. Sugiyama, "Impedance measuring technique for identifying irradiated potatoes," Biosci. Biotechnol. Biochem., **56**, 1929 (1994).
6. T. Hayashi, S. Todoriki, K. Otobe, J. Sugiyama, "Applicability of impedance measuring method to the detection of irradiation treatment of potatoes," J. Jpn. Soc. Food. Sci. Technol., **40**, 378 (1994).